ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

# Полуавтоматическая станция для измерения пластин серии X

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

**П**олуавтоматические зондовые станции серии X

Полуавтоматические зондовые станции серии X предназначены для тестирования пластин диаметром до 300 мм, позволяют проводить измерения при температурах от -60 ℃ до 300 ℃. Возможность управления зондовой станцией с помощью команд SCPI позволяет автоматизировать процесс измерений и минимизировать человеческий фактор при выполнении измерений
Достоинства моделей серии X:

· Тестирование светодиодов/фотодиодов/лазерных диодов (интенсивность

излучения/длина волны)

· Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик тестируемых материалов/изделий

· СВЧ измерения (до 300 ГГц)

· Измерения в широком диапазоне температур

· Скорость перемещения держателя подложек до 70 мм/с

| Модель | | X6/X8/X12 |
|---|---|---|
| Держатель подложек | Диапазон перемещения XY | 350mm*365mm |
| | Разрешение XY | 0.1мкм |
| | Повторяемость XY | ≦±1мкм |
| | Скорость перемещения XY | ≦70 мм/с |
| | Z Диапазон перемещения | 20мм |
| | Z Разрешение | 0.1мкм |
| | Z Повторяемость | ≦±1мкм |
| | Z Скорость перемещения | ≦20 мм/с |
| Температурный диапазон | Диапазон | -60°C-300°C |
| | Стабильность | 0.1°C |
| | Разрешение | 0.01°C |
| Оптическая система с многократным увеличением | | Микроскоп с трехскоростным увеличением 15:1, может одновременно показывать изображения с низким, средним и высоким увеличением, легко наводить иглу |
| Широкое применение | | Поддержка тестирования SiC/GaN пластин, тестирование мощных пластин Сменная конструкция держателя пластин для тестирования различных пластин |
| Функции программного обеспечения | | ① Поддержка полуавтоматического управления (возможен ручной тест или переход на автоматический) |

| |
|---|
| ② Автоматическое выравнивание пластин |
| ③ Автоматическое измерение размера матрицы |
| ④ Автоматическое картирование пластин и удаленный доступ к данным |
| ⑤ Свободное управление и программирование входных и выходных параметров |
| ⑥ Быстрая интеграция нескольких тестеров |
| ⑦ Автоматическая радиочастотная калибровка одной кнопкой, функция автоматической очистки иглы |
| ⑧Поддержка тестирования по одной точке и непрерывного тестирования |

| |
|---|
| ⑨Автоматическое сохранение данных, синхронная обработка данных |
| ⑩Классификация результатов тестирования и отображение их разным цветом на карте пластин |
| Контроль предельной скорости и блокировка безопасности |